

10. Euroopa Testisümposion Tallinnas

21. – 26. mail 2005. aastal toimub Tallinnas ülemaailmse ulatusega juubeliüritus 10. Euroopa Testisümposion (10. IEEE European Test Symposium) – konverents mille temaatika haarab infotehnoloogia süsteemide testimist, diagnostikat ja veakindlust. Arvutite tõrgeteta töö on teema, mis on eluküsimuseks igale infotehnoloogiaga seotud tööstusfirmale, aga samas puudutab ka igat üksikut inimest ning tema elukvaliteeti, sest oleme ju täna kõik sõltuvad arvutitest.

Sümposiumi korraldajaks on Tallinna Tehnikaülikool. Nimetatud üritus on selle valdkonna kõige esinduslikum foorum terves maailmas. Tallinna on oodata tippteadlasi ja tööstusjuhte rohkem kui 30 riigist üle maailma – Euroopast, USAst, Jaapanist ja mujalt (kokku umbes 150-200 esindajat). Esmakordselt toimub selline konverents väljaspool Lääne-Euroopat. Tihedas konkurentsisis 7 Euroopa riigi hulgas nagu Inglismaa, Saksamaa, Austria jt. võideti seekord õigus korraldada see üritus Tallinnas. See on kahtlemata suureks tunnustuseks konverentsi korraldajatele, Tallinna Tehnikaülikooli teadlastele.

Sümposioonile esitati 154 ettekannet 32 riigist. Tihedas konkurentsisis, kus ettekandeid analüüsisid kuni 6 retsensenti, valis sümposiooni programmikomitee välja 31 kõige väljapaistvamat artiklit. Seega vaid iga viies teadustöö jäi sõelale, mis garanteerib lõppkokkuvõttes konverentsi kõrge kvaliteedi ja taseme. Meeldiv on tõdeda, et kaks välja valitud ettekannetest kuulub Tallinna Tehnikaülikooli teadlastele (G.Jervan, J.Raik, T.Shchenova, R.Ubar).

Lisaks regulaarsetele akadeemilistele ettekannetele uusimatest teadustulemustest 10 sektsioonis, on sümposioonil kavas veel kaks plenaarettekannet valdkonna kuumadel teemadel, neli ülevaatelist ettekannet spetsiaalselt välja valitud teemadel, 41 posterettekannet (s.h. 2 TTÜ teadlastelt) ja 13 ettekannet tööstuslike rakenduste alal. Väga huvitavaks töötab kujuneda paneeldiskussioon teemal “Kas nanotehnoloogia tähendab uue paradigma sündi elektroonikasüsteemide testimisel?”

Enne sümposiooni viiakse läbi kaks paralleelset 1-päevast õppekursust (tutoriali) magistrandidele, doktorandidele ja inseneridele tööstusest. Pärast sümposiooni toimub täiendav elektroonikasüsteemide tööstuslikule testimisele pühendatud seminar.

Suurt rahvusvahelist huvi nimetatud ürituse vastu tõendab suur hulk välissponsoreid maailma tähtsaimate firmade näol elektroonikasüsteemide projekteerimise vallas. Ainsaks Eesti firmaks, kes toetab sümposiooni sponsorina, on Artec Group.

Täiendavat üksikasjalist informatsiooni sümposiooni kohta võib leida kodulehelt aadressil (<http://ati.ttu.ee/ETS/>).

Konverentsil käsitletav teemade ring peaks pakkuma suurt huvi infotehnoloogiaga tegelevatele ettevõtetele võimaldades kohtumist ja konsultatsioone maailma tipptegijatega valdkonnas, kus missiooniks on tagada infosüsteemide usaldatavus ning häireteta kvaliteetne funktsioneerimine.

Sümposiooni kaasesimeesteks on Raimund Ubar (Eesti) ja Paolo Prinetto (Itaalia), programmikomitee esimeheks Michel Renovell (Prantsusmaa) ja kohaliku korralduskomitee esimeheks Jaan Raik (Eesti).

Raimund Ubar
Tallinna Tehnikaülikool

Sümposiooni programm

22. mai. Tutorialid

1. Y. Zorian (USA). Kiipsüsteemide testimine praltikas
2. J.L. Huertas (Hispaania). Analoo- ja segasignaali-integraalskeemide disain ja test.

23. mai. Plenaarettekanne

1. J. Figueras (Hispaania). Defektid ja uued rikete mehhanismid elektroonikasüsteemides.

24. mai. Ülevaate-ettekanded

1. J. Segura (Hispaania). Testimismeetodid nanotehnoloogias.
2. P. Maxwell (USA). CMOS kujutiste sensorid ja optiline testimine.

25. mai. Ülevaate-ettekanded

3. H.G. Kerkhoff (Holland). Mikro-elektromehaaniliste süsteemide (MEMS) testimine
4. H.J. Wunderlich (Saksamaa). Ise-testimisest ise-diagnostikani.

23.-25. mai. Ettekanded sektsioonides:

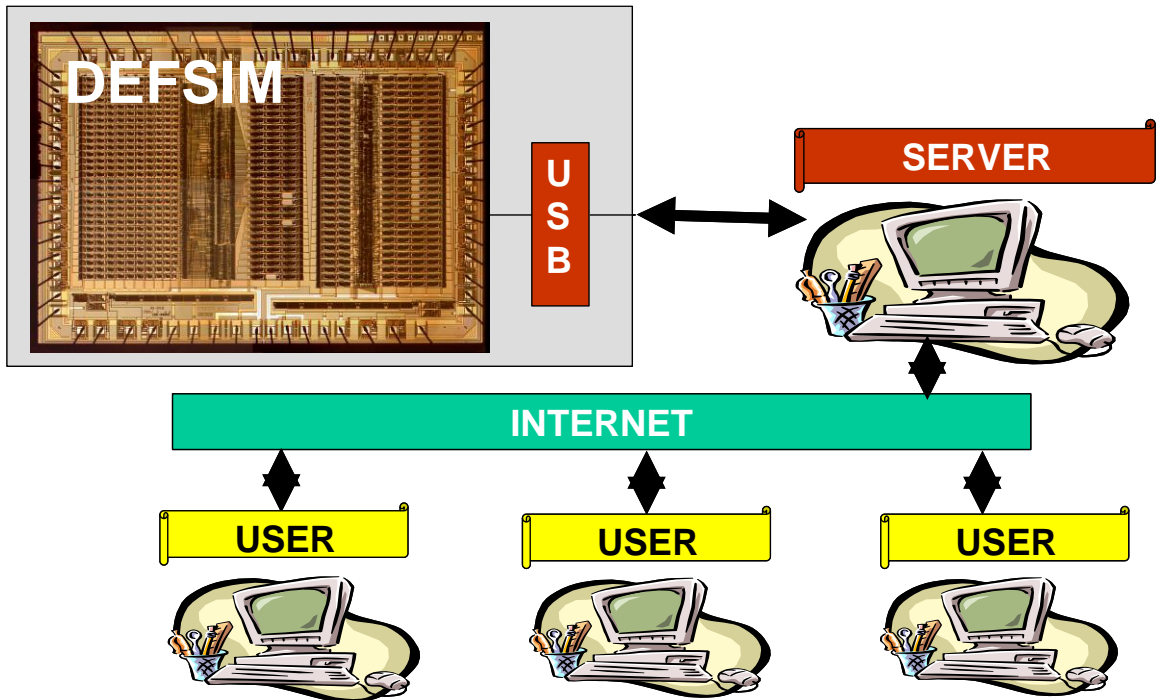
1. Kiipsüsteemide (SOC) testimine
2. Edusammud rikete ja defektide modelleerimisel
3. Uusi tulemusi testide genereerimise teemal
4. Efektiivne testide genereerimine ja optimeerimine
5. Keerukate analoogskeemide testimine
5. Mikro-elektromehaaniliste süsteemide isetestimine
6. Defektide ja dünaamiliste rikete testimine
7. Mäluseadmete testimine
8. Regulaarsete struktuuride testimine
9. Edusammud diagnostikas
10. Molekulaarelektroonika testimine

25.-26. mai. Spetsiaalne seminar

Elektroonikasüsteemide tööstuslikule testimisele pühendatud seminar

Eesti teadlaste poolt esitatavad ettekanded:

1. G.Jervan, R.Ubar, T.Shchenova (Eesti), Z.Peng (Rootsi). Energiatarbe minimeerimine hübriid-isetestivates süsteemides.
2. J.Raik, R.Ubar (Eesti), J.Sudbrock (Saksamaa), W.Kuzmicz, W.Pleskacz (Poola). Uus deterministlik defekt-orienteeritud testigeneraator.
3. J.Raik, R.Ubar (Eesti), Y.Skobtsov, D.Ivanov, V.Skobtsov (Ukraina). Geneetilistel algoritmidel põhinev funktsionaalne isetestimine digitaalsüsteemides.
4. A.Jutman (Eesti). Efektiivne ühenduste isetestimine ja –diagnostika digitaalsüsteemides.



Tallinna Tehnikaülikooli ja Varssavi Tehnikaülikooli teadlaste poolt välja töötatud veebipõhine laboratoorne keskkond reaalsete füüsiliste defektide kaug-uurimiseks